

EINLADUNG

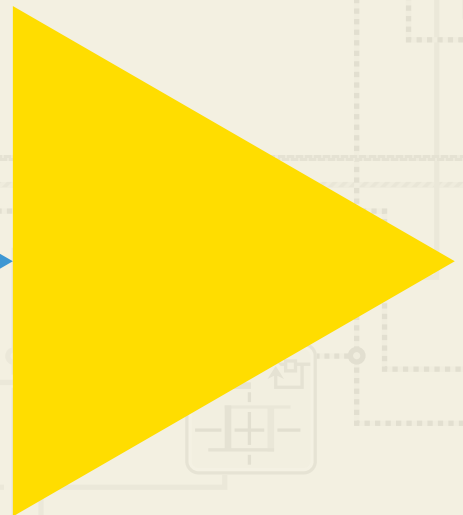
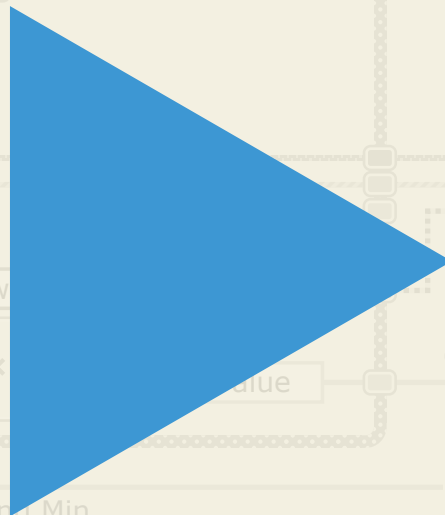
TECHNOLOGIE- UND ANWENDERKONGRESS

24.-25. OKTOBER 2018 | FÜRSTENFELDBRUCK BEI MÜNCHEN | NI.COM/VIP

VIP2018

FUTURE

FASTER



VIP2018

VIRTUELLE INSTRUMENTE IN DER PRAXIS

VIP 2018 - Seien Sie dabei!

Wir laden Sie herzlich zu unserem Technologie- und Anwenderkongress „VIP 2018 – Virtuelle Instrumente in der Praxis“ ein, der am **24. – 25. Oktober** in Fürstentfeldbruck stattfindet.

SCHNELLER IN DIE ZUKUNFT

Sie möchten schneller Ihre leistungsfähigen Test- und Messsysteme entwickeln und automatisieren? Dann sollten Sie dieses Highlight nicht verpassen! Auch dieses Jahr erwarten wir mehr als 700 Ingenieure, Wissenschaftler und Branchenführer auf dem Technologie- und Anwenderkongress „VIP 2018“, die mehr über die softwarezentrierte Plattform von NI erfahren möchten.

- **Erleben Sie neueste Technologien hautnah!**

In spannenden Keynotes und Fachvorträgen sowie Praxisworkshops und Produktvorführungen erfahren Sie von NI-Experten, Kunden und Partnern des NI-Ecosystems alles über die neuesten Entwicklungen im Bereich der automatisierten Test- und Messsysteme.

- **Lernen Sie in unseren neuen Development Tracks wertvolle Best Practices kennen!**

Gemeinsam mit den anwesenden Branchenexperten, langjährigen LabVIEW-Entwicklern und Kollegen können Sie Techniken und Konzepte entwickeln, die Sie beim erfolgreichen Aufbau eines maßgeschneiderten Systems unterstützen. Finden Sie heraus, mit welchen innovativen Best Practices Sie Ihr System an neue und sich verändernde Prüfanforderungen anpassen können, um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben!

- **Knüpfen Sie Kontakt mit Branchenführern und Experten!**

Treffen Sie Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum zum Erfahrungsaustausch sowie führende Vertreter von NI aus den Bereichen R&D und Produktmarketing zu persönlichen Gesprächen rund um den Einsatz neuer Technologien, Roadmaps und Projektmeilensteine!

Sie haben noch Fragen? Die ausführliche Agenda und die neuesten Informationen zum Kongress finden Sie auf unserer Website unter: ni.com/vip.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



ppa. Rahman Jamal
Business and Technology Fellow
National Instruments



Georg Plasswilm
Geschäftsführer & Sales Director, Central Europe
National Instruments

Keynotes

BEGRÜSSUNG: **Georg Plasswilm**, Geschäftsführer & Sales Director, Central European Region, National Instruments

MITTWOCH - 09:30 – 10:45 UHR

DONNERSTAG - 09:00 – 10:00 UHR

Lassen Sie sich von Entscheidungsträgern und Vordenkern aus der Industrie inspirieren, die sich zu künftigen Branchentrends aus den Bereichen Automotive, Halbleitertechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Ausbildung und Lehre äußern. Erfahren Sie von Fachkollegen, wie diese mit neuesten NI-Technologien ihre Herausforderungen bewältigen konnten und profitieren Sie von deren Einblicken und unseren Erkenntnissen, die wir Ihnen auf der VIP-Bühne präsentieren.



Vortragsreihen

AUTOMOTIVE TEST & VALIDATION

In diesem zweitägigen Track „Automotive Test & Validation“ geht es um zwei große Trends in der Automobilindustrie: dem autonomen Fahren und den damit einhergehenden Herausforderungen in den Bereichen ADAS und V2X-Kommunikation. Außerdem betrachten wir das Thema Elektrifizierung aus dem Blickwinkel des Testens, vom Design bis zur Produktion.

SEMICONDUCTOR TEST

Wenn jedes Gerät mit mehr RFICs und MEMS ausgestattet wird, sind mehr Sensor- und RF-Tests nötig. Dabei sollen getätigte Investitionen und eine optimale Testabdeckung gewahrt werden – am besten mit einer Messplattform, die vom Labor über die Charakterisierung bis in die Halbleiterproduktion skaliert.

AEROSPACE & DEFENSE

Luft- und Raumfahrttechnologie wird immer komplexer und die Fristen für die Bereitstellung von Testsystemen immer kürzer. Das erfordert intelligentere Lösungen für eine schnelle Systemintegration und die Unterstützung älterer Programme. Mit flexibel anpassbaren Hard- und Softwareplattformen lassen sich Testsysteme zügig entwickeln und zertifizieren, neue Technologien einbinden und die Gesamtprüfkosten senken.

ACADEMIC TEACHING

Wie wird Theorie anschaulich vermittelt? Wie wird das Erlernete für Studenten relevant? Vor diesem Hintergrund spannen wir den Bogen von neuen NI-Technologien über praktische Beispiele aus der Lehre bis zur Diskussion über die Frage: Was muss ein Student können, um erfolgreich in den Beruf zu starten?

ACADEMIC RESEARCH

Ingenieure und Wissenschaftler nutzen NI-Produkte auf vielfältige und innovative Art und Weise, um Unbekanntes zu entdecken, und inspirieren damit auch andere. Erfahren Sie, was möglich ist, wenn Sie die gewohnten Pfade verlassen und die Haltung des „So haben wir das schon immer gemacht“ hinterfragen.

SKILLS DEVELOPMENT – SOFTWARE ENGINEERING

Lernen Sie in diesem innovativen neuen Format Herangehensweisen kennen, mit denen Sie Anforderungen richtig erfassen, verfolgen und umsetzen und den kompletten Entwicklungsprozess mit Continuous-Integration-Ansätzen automatisieren können, um Fehler und wiederkehrende Prozesse zu vermeiden.

Vortragsreihen

SKILLS DEVELOPMENT – DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED APPLICATIONS

Applikationen werden aufgrund wachsender Anforderungen immer komplexer, sei es durch Einbinden verschiedener Dienste oder vielfältiger Hardware. Gemeinsam mit Bereichsexperten, Anwendern und Partnern beleuchten wir die Aspekte, die bei der Entwicklung einer solchen Applikation zu betrachten sind.

BUSINESS & TECHNOLOGY TRENDS

Die Vortragsreihe „Business & Technology Trends“ beleuchtet jedes Jahr wichtige Neuigkeiten und Weiterentwicklungen und gibt technologische Ausblicke für und rund um den Bereich automatisiertes Messen und Testen. Daneben stehen immer auch relevante Unternehmens- und Wirtschaftsaspekte im Mittelpunkt.

DATA MANAGEMENT

Big Analog Data: Seit Jahren müssen wir mit steigenden Datenmengen aus zunehmend vernetzten Quellen arbeiten. Wir besprechen aktuelle Trends und technologische Neuerungen, wie firmenweite Analyzelösungen, und zeigen reale Anforderungen aus der Automobilindustrie, z. B. von Daimler und Volkswagen.

AUTOMATED MEASUREMENTS

Wir zeigen, wie Ingenieure und Wissenschaftler mit softwaredefinierten, automatisierten Messsystemen reale Herausforderungen bewältigen. Lernen Sie unsere neueste Datenerfassungshard- und -software kennen und erfahren Sie mehr zu Trends und Technologien sowie deren Einfluss auf die Zukunft unserer Plattform.

SKILLS DEVELOPMENT SOFTWARE ENGINEERING - WORKSHOPS

Als Fortsetzung zur Vortragsreihe „Skills Development Software Engineering“ wird es am zweiten Tag zu den zwei Themenschwerpunkten Requirements und Continuous Integration Workshops geben, bei denen Sie die Möglichkeit haben, die Diskussionen zu vertiefen und sich auszutauschen.

HANDS-ON NI HARDWARE AND SOFTWARE

Testen Sie unsere Hard- und Software, indem Sie sie selber ausprobieren oder die Step-by-Step-Anleitungen nutzen. Profitieren Sie dabei von unseren Experten vor Ort, die Ihnen helfen, erste Stolpersteine bei der Evaluierung aus dem Weg zu räumen, um so schnell einen guten Eindruck zu bekommen.



09:30	KEYNOTE (STADTSAAL)							
10:45	KAFFEEPAUSE/ BESUCH DER AUSSTELLUNG							
	Skills Development – Software Engineering	Automotive Test & Validation	Academic Teaching	Semiconductor Test	Data Management	Automated Measurements	Hands-on NI Hardware and Software	
11:15	Anforderungen – Erfassen, Verfolgen und Umsetzen Norbert Brand, National Instruments	Die Automobilindustrie verändert sich nicht erst jetzt. Sie hat sich bereits verändert. (EN) Jamie Smith, National Instruments	Hürden beim projektbasierten Lernen mit dem neuen NI ELVIS III überwinden (EN) National Instruments	Aktuelle Trends und neue Produkte für den Halbleitertest Christian Spieß, Vanessa Blumenstein, National Instruments	Vernetzte Datenflüsse: Das Beste aus allen Welten verbinden Andreas Haub, National Instruments	Neue Technologien für Anwendungen zum Datenloggen – FlexLogger National Instruments	Hardware: PXI CompactDAQ CompactRIO Software: TestStand LabVIEW LabVIEW Real-Time LabVIEW FPGA LabVIEW NXG und mehr Supported by NI Application Engineers	
12:00	Oliver Wachno, Bürkert Werke GmbH & Co. KG Peter Emmenegger, Emmenegger Engineering GmbH Markus Schram, Konrad GmbH Ralf Taraschewski, kumkeo GmbH	Herausforderungen bei elektrischen Prüfungen nach LV 124/LV 148 am Beispiel von Lidar (EN) Andreea Solomon, WKS Informatik GmbH Frank Polziehn, Valeo	Warum von begabten Wissenschaftlern geschriebene Software häufig furchtbar ist – und wie sich das mit dem Academic Graduate Program ändern lässt Fabian Wehnekamp, National Instruments	Neue Herangehensweise in der Component Verification - Ein Automatisierungskonzept für die Laborumgebung (EN) Thorsten Bucksch, Infineon Technologies	DIAdem und DataFinder Server – Highlights der aktuellen Versionen Walter Rick, National Instruments	Vergleich in der Anwendung von cRIO und cRIO mit DAQmx am Beispiel eines Mikrogravitationsexperimentes im TEXUS-Programm Klaudius Pinkawa, AMS Software GmbH		
12:45	MITTAGESSEN/ BESUCH DER AUSSTELLUNG							
14:30	Softwaretest – Werkzeuge, Normen und andere Herausforderungen Stefan Kissel, National Instruments	Anbindung, Montage und Test von Fahrzeugkameras für aktive Sicherheitssysteme Michael Konrad, Konrad Technologies	Einführung in die Zustandsüberwachung von Maschinen mittels Vibrations- und Schallmessungen anhand von praktischen Beispielen Prof. Georg Eggers, Hochschule München	Automatisierungs-Framework für Labormessungen zur Post-Silizium-Verifikation von Automotive Sensor SoCs (EN) Thomas Thurner, Alexander Magnes, Infineon Technologies	Automatisierte Analyse von Nutzfahrzeug-Straßendauerlaufdaten Martin Winkler, measX GmbH & Co. KG Mathias Harfingler, Daimler AG	Erweiterung Ihrer Messgeräteplattform durch die SLSC-Architektur (EN) Michael Hutton, National Instruments	Hardware: PXI CompactDAQ CompactRIO Software: TestStand LabVIEW LabVIEW Real-Time LabVIEW FPGA LabVIEW NXG und mehr Supported by NI Application Engineers	
15:15	Peter Bokor, IncQuery Michael Kollmetz, MBDA Deutschland GmbH	LTE-V im Test – Ein alternativer Kommunikationsstandard für V2X- und ADAS-Anwendungen Gerd Schmitz, S.E.A. Datentechnik GmbH	Smarte Systeme vermitteln (Bachelor) – Smarte Ingenieure für die Industrie Prof. Andreas Wendemuth, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg	Sensortest für ADAS – Designvalidierung von ASIL-D-Chips Frank Heidemann, SET GmbH	Vom CAN-Bus bis zur Data Management Software Suite bei Volkswagen Holger Müller, müller+krahmer GmbH Carsten Petsch, Volkswagen	Smarte Lösung für Mess- und Prüfanwendungen Andreas Sokoll, Bosch Rexroth AG Martin Müller, Querpunkt GmbH		
16:00	KAFFEEPAUSE/ BESUCH DER AUSSTELLUNG							
16:30	Continuous Integration – Automatisieren Sie den Test, die Erstellung und die Verteilung Ihrer Applikationen Lorenz Casper, National Instruments	Autonomes Fahren verlangt nach universellen Testlösungen mit einer Skalierung von NF über 5G bis zu 80 GHz Radar Test Markus Solbach, Ludwig Mair, Noffz Technologies	Kompetenzentwicklung von Studierenden im Rahmen der Kooperation zwischen FH Joanneum und NXP Austria Thomas Messner, FH Joanneum Wolfgang Rominger, NXP Semiconductor Austria	Die nächste Generation der Analyse dynamischer Signalverläufe Manuel Paukner, Texas Instruments	Testen in regulierten Umfeldern am Beispiel WLTP Jan Jacob, Werum Software & Systems AG	Automatisierung eines Funktionsprüfstands für elektrische Wankstabilisatoren mit NI VeriStand Michael Winter, IABG mbH Sebastian Bultmann, ZF Friedrichshafen AG	Hardware: PXI CompactDAQ CompactRIO Software: TestStand LabVIEW LabVIEW Real-Time LabVIEW FPGA LabVIEW NXG und mehr Supported by NI Application Engineers	
17:15	Sven Peterson, S.E.A. Datentechnik GmbH Jörg Hampel, Hampel Software Engineering Romano Renelt, Denis Grgic, NXP Semiconductor Austria	Effiziente Restbussimulation in komplexen Automotive-Elektronik-Testprojekten Dr. Björn Butting, MBtech Group GmbH & Co. KGaA	Paneldiskussion: Business Meets Teaching Wolfgang Rominger, NXP Semiconductor Austria Michael Konrad, Konrad Technologies Prof. Andreas Wendemuth, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg Thomas Messner, FH Joanneum Fabian Wehnekamp, Heiner Illig, National Instruments	Weise Worte: Erkenntnisse aus dem Einsatz des NI Semiconductor Test Systems in der Produktion (EN) Banukumar Murugesan, Tessolve	Benchmarking-Strategien in der Automobilindustrie Matthias Salmen, FEV Software and Testing Solutions	Kochen mit dem Thermomix ist einfach – Testen ist es nicht Benjamin Tillmann, Vorwerk Elektrowerke Christian Pastucha, SET GmbH		
ab 18:00	BESUCH DER AUSSTELLUNG							
ab 19:00	ABENDESSEN/GET-TOGETHER							

09:00	KEYNOTE (STADTSAAL)						
10:00	KAFFEEPAUSE/ BESUCH DER AUSSTELLUNG						
	Skills Development – Development of Distributed Applications	Automotive Test & Validation	Academic Research	Aerospace & Defense	Business & Technology Trends	Hands-on NI Hardware and Software	Skills Development Software Engineering - Workshops
10:30	Neuigkeiten zur NI-Software-Roadmap National Instruments	Schnellere Markteinführung mit optimierten Ansätzen für Antriebsstrangtests von Elektrofahrzeugen Daniel Riedelbauch, National Instruments	Speckle-Bildgebung in Echtzeit für die gesteuerte retinale Photokoagulation Katharina Bliedner, Medizinisches Laserzentrum Lübeck	Best Practices für den Entwurf eines automatisierten Prüfsystems National Instruments	Lernen für Leadership 4.0 in der Zeitmaschine Marco Schmid, Schmid Elektronik AG	Hardware: PXI CompactDAQ CompactRIO Software: TestStand LabVIEW LabVIEW Real-Time LabVIEW FPGA LabVIEW NXG und mehr Supported by NI Application Engineers	Evaluieren Sie das NI Requirements Gateway Norbert Brand, National Instruments
11:15	Gesetzliche Aspekte der normgerechten Entwicklung Oliver Wachno, Bürkert Werke GmbH & Co. KG	Lebensdauertest von Invertern für den Antriebsstrang in Elektrofahrzeugen unter Verwendung simulierter Motoren Michael Rost, IRS Systementwicklung GmbH	„Rotating Detonation Engine“-Prüfstand auf Basis eines MXI-Express-Chassis – Vom Konzept zur Prüfstandssoftware David Holst, Technische Universität Berlin	Aerospace-HIL in acht Monaten Frank Heidemann, SET GmbH	Neue Mitarbeiter effizient ins Team integrieren – Onboarding für Ingenieure Wolfgang Rominger, NXP Semiconductors Austria Lorenz Casper, National Instruments		
12:00	MITTAGESSEN/ BESUCH DER AUSSTELLUNG						
13:30	LabVIEW NXG Web Module: Entwicklung webbasierter Benutzeroberflächen Josef Eiswirth, measX Rita Prather, National Instruments	Entwicklung und Aufbau eines Prüfstands für Fahrzeug-Starter-Generatoren Thomas Mertke, Bertrand Ingenieurbüro GmbH	Sensor Fusion in Life Science: Echtzeitverfolgung biologischer Vorgänge mit Nanometer-Auflösung Frank Mieskes, Ludwig Maximilians Universität München	Thermografische Inspektion von Klebefugen im Flugzeugbau mit LabVIEW (EN) Marc Hill, ZeMA	High-Performance-Blockchain-Anwendungen im Energiesektor Andreas Hergesell, MetaDAQ, Ingenieurbüro für innovative Messtechnik	Hardware: PXI CompactDAQ CompactRIO Software: TestStand LabVIEW LabVIEW Real-Time LabVIEW FPGA LabVIEW NXG und mehr Supported by NI Application Engineers	Modellgetriebene Entwicklung in der Praxis – Mit Methodik zu nachhaltigem LabVIEW-Code Rald Taraschewski, Sven Tanneberger, kumkeo GmbH
14:15	NI-Funktionen für das Erstellen verteilter webbasierter Anwendungen Rita Prather, National Instruments	Intelligentes Loggen von Signalen in der Entwicklung von Komponenten für die Elektromobilität Nils Dornblut, Josef Hiermeier, Innofas GmbH	Sie wollen ganz sichergehen? Verwandeln Sie Software in Hardware anschaulich erklärt am Beispiel des Neutrinoexperiment Karlsruhe TRItium Neutrino (KATRIN) (EN) Armen Beglarian, Karlsruhe Institut of Technology	GSM-Passiv-Radar mit NI-USRP-RIO-Mehrkanal-Empfangssystem Matthias Mandt, Fraunhofer Institute for Communication	Panel Discussion		
15:00	KAFFEEPAUSE/ BESUCH DER AUSSTELLUNG						
15:30	Kommunikationstechnologien im Kontext von IIoT und Cloud-Diensten Stefan Kissel, National Instruments	Testen von Batterien für den Antriebsstrang in der Fertigung Andreas Sokoll, Bosch Rexroth AG	Kräfteüberwachung in Magnetspulen eines Fusionsexperiments Alexander Sigalov, Claus-Peter Käsemann, Max-Planck-Institut	Softwaretest –Tools, Normen und andere Herausforderungen Sven Tanneberger, Ralf Taraschewski, kumkeo GmbH	Wie Machine Learning und künstliche Intelligenz traditionelle Prüfstrategien in Frage stellen (EN) Marcus Monroe, National Instruments	Hardware: PXI CompactDAQ CompactRIO Software: TestStand LabVIEW LabVIEW Real-Time LabVIEW FPGA LabVIEW NXG und mehr Supported by NI Application Engineers	Live-Demonstration von Arbeitsabläufen in einer automatisierten Software-Entwicklungsumgebung Jörg Hampel, Hampffel Software Engineering Sven Peterson, S.E.A. Datentechnik GmbH
16:15	Migration –Verbesserung durch Veränderung Falk Wurster, Karsten Dallmeyer, Vikings Software GmbH	Validierungs-Test von Hochvolt-Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge Philipp Miska, Berghof Automation GmbH	Die Zukunft des Transportwesens – EPFLoop und Swisstrom treiben Hyperloop-Technologie voran (EN) Denis Tudor, EPFLoop	Modularer Sensoraufbau zur echtzeitfähigen Bilddatengewinnung Florian Mühlbauer, MBDA Deutschland GmbH	Mit der richtigen Prüfstrategie Produktentwicklung und Markteinführung beschleunigen (EN) Augusto Mandelli, Robert Lee, National Instruments		
17:00	ENDE DER VERANSTALTUNG						

Rahmenprogramm

MEET THE EXPERTS

Mittwoch | 18:00 – 19:00 Uhr

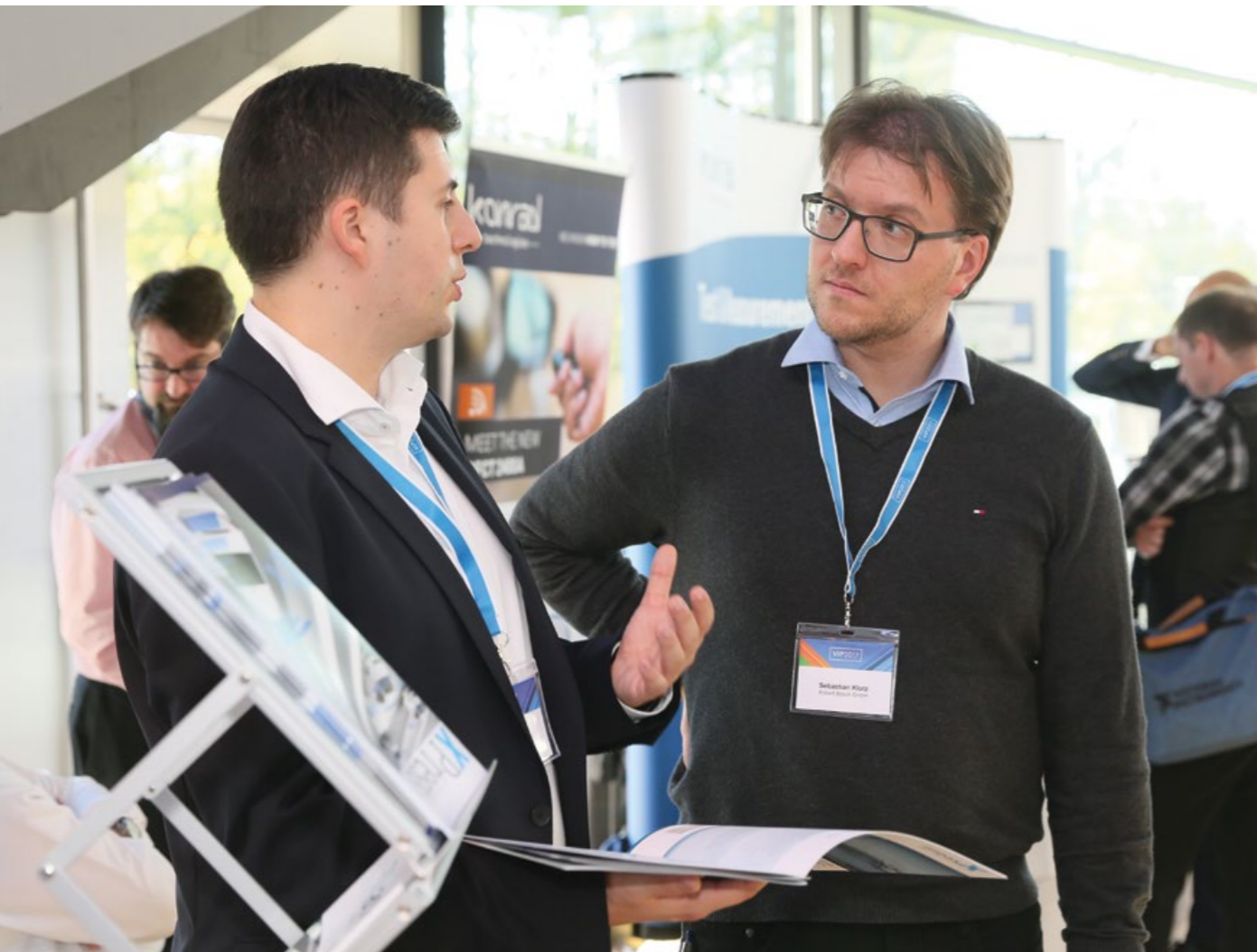
Treffen Sie Experten von NI sowie erfahrene Anwender und stellen Sie Ihre Fragen. Schauen Sie einfach vorbei und lassen Sie den ersten Tag in einer Diskussionsrunde ausklingen. Den genauen Standort der Experten entnehmen Sie bitte dem Lageplan vor Ort.

GET-TOGETHER

Mittwoch | ab 19:00 Uhr

Kontakte knüpfen, Gedanken austauschen, Netzwerke pflegen:

Der Ideenaustausch sowie das Knüpfen von Kontakten stehen im Mittelpunkt des gemütlichen Ausklangs des ersten Kongresstages. Dieser wird mit einem gemeinsamen Abendessen zu Ende gehen und bietet Ihnen die Möglichkeit zum ungezwungenen Networking mit Referenten, Ausstellern, NI-Experten und anderen Kongressteilnehmern. In Anschluss daran sind Sie herzlich zur VIP-Party eingeladen um den Kongresstag in entspannter Atmosphäre abzurunden.



Ausstellung

Im Rahmen des VIP 2018 präsentieren rund 40 Alliance Partner, Produktpartner und Systemintegratoren ihre aktuellsten Anwendungen, Lösungen und Produkte.

Informieren Sie sich auf der großzügigen Ausstellungsfläche über die neuesten Entwicklungen und tauschen Sie sich mit den Ausstellern über deren Serviceangebote und Lösungsstrategien aus.

Von der Erstellung eines einzelnen Produkts über ganze Systeme und deren Integration bis hin zu Beratung und Training – VIP-Aussteller verfügen über die optimale Kombination von technischer Ausstattung und Know-how, um auch anspruchsvolle ingenieurtechnische Herausforderungen zu lösen.

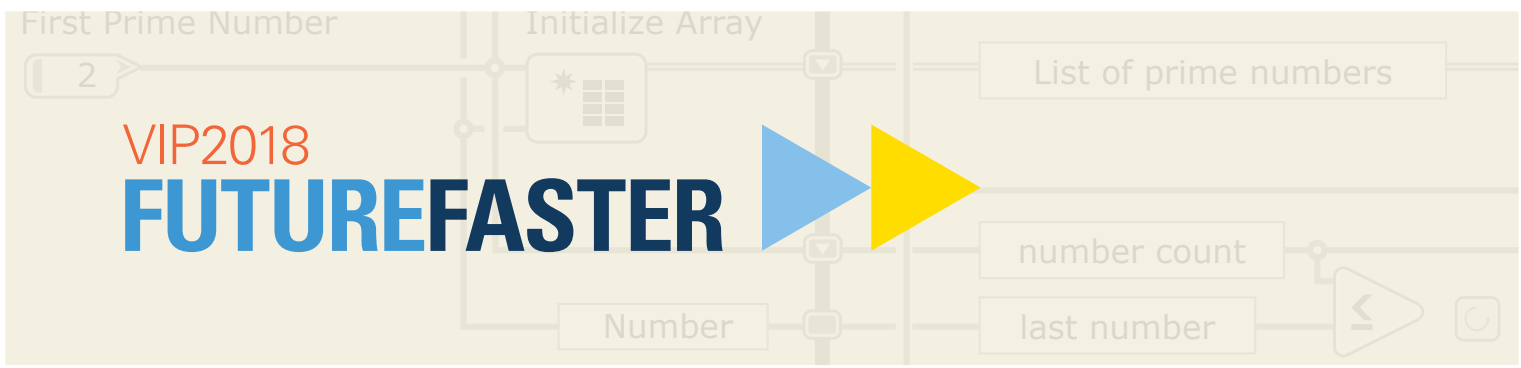
- **Mittwoch** 9:00 – 20:00 Uhr
- **Donnerstag** 9:00 – 17:00 Uhr

DIAMOND AUSSTELLER



AUSSTELLERLISTE (Stand: Juni 2018)

A.M.S. Software GmbH	Konrad GmbH
ATX Hardware GmbH West	KUNBUS GmbH
Beck-Messtechnik	Lenord, Bauer & Co. GmbH
Berghof Automation GmbH	MEquadrat AG
Bosch Rexroth AG	ODU GmbH & Co. KG
CGS - Computer Gesteuerte Systeme GmbH	PCB Synotech GmbH
CISWORKS GmbH & Co. KG	ProNES Automation GmbH
esz AG calibration & metrology	S.E.A. Datentechnik GmbH
FEV Software and Testing Solutions	SET GmbH
Göpel electronic GmbH	Sohatex Engineering GmbH & Co KG
Helbling Technik AG	SOMA GmbH
INGUN Prüfmittelbau GmbH	SYSTEC GmbH
innofas GmbH	Virginia Panel Corporation
IPG Automotive GmbH	Virinco AS
IRS Systementwicklung GmbH	WireFlow AB
ITK Engineering GmbH	WKS Informatik GmbH



Anmeldung und Services

PREISE

TICKETS

24. – 25. Oktober 2018	€ 525* € 600
24. Oktober 2018	€ 365
25. Oktober 2018	€ 365

GRUPPENTICKET (4 FÜR 3)

24. – 25. Oktober 2018	€ 1575* € 1800
------------------------	------------------

HOCHSCHULTICKET

24. – 25. Oktober 2018	€ 225
------------------------	-------

Alle Preise in Euro zzgl. Mehrwertsteuer
* Frühbuchertarif bis einschließlich 12. August 2018
Gruppenticket: Die Teilnehmer müssen der gleichen Firma angehören.
Hochschultarif: Gilt für alle Hochschulangehörigen und Studenten.

LEISTUNGEN, KONDITIONEN

UND RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN

Alle Informationen zu enthaltenen Leistungen, Konditionen sowie Rücktrittbedingungen finden Sie online unter ni.com/vip.

VERANSTALTUNGSORT

Veranstaltungsforum Fürstenfeld
Fürstenfeld 12
82256 Fürstenfeldbruck (bei München)

Fuerstenfeld.de

ANMELDUNG

Das **Anmeldeformular** finden Sie online unter ni.com/vip.

Die Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt.

Wir empfehlen Ihnen eine **frühzeitige Anmeldung**.

HABEN SIE FRAGEN ZUR ANMELDUNG?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte senden Sie eine E-Mail an cer.events@ni.com oder rufen Sie uns an unter Tel. **+49 (0) 89 741313-0**.

DIE VIP-2018-SERVICES – WIR SIND FÜR SIE DA!

HOTELS

Empfehlungen und vorab reservierte Kontingente unter: ni.com/vip.

BUS-SHUTTLE

- Informationen zu Abfahrtszeiten unserer Shuttle-Busse finden Sie unter: ni.com/vip

VERANSTALTER

National Instruments Germany GmbH
Ganghoferstraße 70b
80339 München

Tel.: **+49 (0)89 74131310**

Fax: **+49 (0)89 7146035**

info.germany@ni.com

